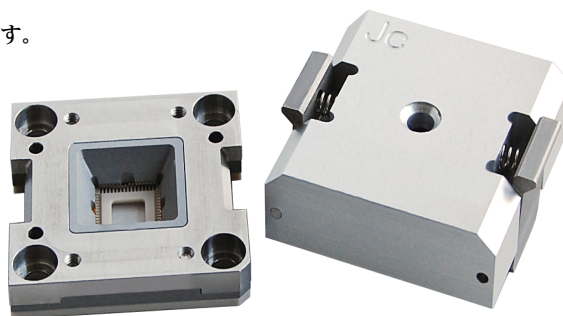


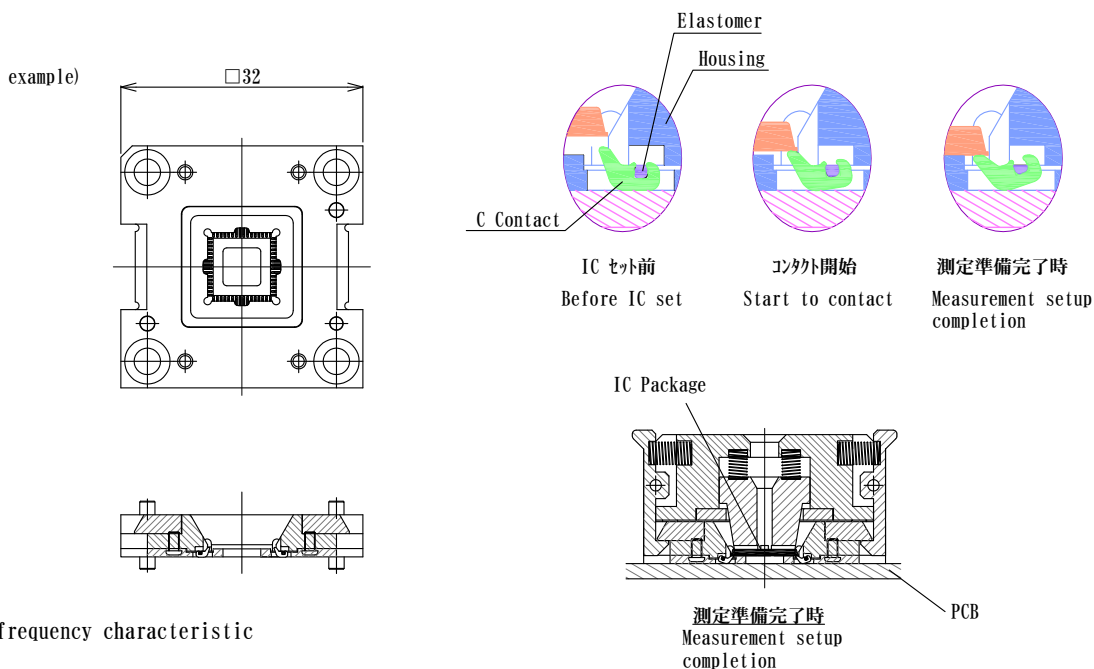
コンタクトテストソケット C Contact Test Socket

近年、高周波デバイスの需要増加にともない
テストソケットにも高周波対応であることが求められています。
Cコンタクトソケットはコンタクト長が1.3mmと短く、優れた高周波特性を保持しています。
セルフクリーニング構造によりコンタクトのクリーニング頻度を減らし、
高寿命化を実現しました。
また、基板接触部はコンタクトのローリング動作により、
基板へのダメージを低減しています。

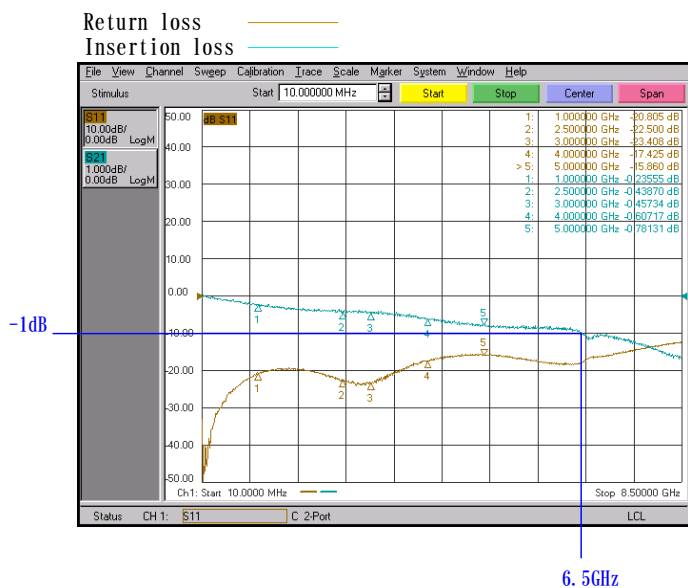
Because of the recent increased demand for high-frequency devices, it is necessary that test socket adapt to high-frequency range. We have developed C Contact Socket to meet such a demand from the customers. Our C Contact has excellent high-frequency characteristics using short contact length of 1.3mm. Contact structure enables self-cleaning to lessen the frequency of cleaning and realizes longer life, and rolling movement of C Contact at points of contact reduces damage on PCB.



別ピンソケット方式も可能ですので
お問合せください



High frequency characteristic



Specification

- Contact Material : Copper alloy, etc.
- Finish : Gold over Ni plated
- Current Rating : 1A
- Contact Resistance : max 50mΩ
- Insulator Material : PEEK etc
- Self Inductance : 0.36nH
- Capacitance : 0.5pF